

(19) (KR)
(12) (A)

(51) 。 Int. Cl.⁷ (11) 10-2004-0062051
G02F 1/13 (43) 2004 07 07

(21) 10-2002-0088364
(22) 2002 12 31

(71) . 20

(72) 203 401

101 1306

(74) :

(54)

4 2

가

3a

1 .
2a 2b MPS
3a 3b .

< >

16 : 16' :

18 : 18' :

20 : 21 :

60 : 70 :

70' : 71, 71' :

90 :

가 (TF
T) 가 1 가
가 가
가 (12) (12) (6) IPT(In
(GND) Processing Test)
(glass) 2 4 가 (12) IPT
가 가
1
1 (12) (G) (11) (14, 14') (12) (1
2) , (D) (14, 14') , / (14, 14')
/ (14) / (14') IPT(In Processing Test)
(18, 18') (Shorting Bar)(16, 16')
(Cutting)

, (12) (C) (G), (D) (C)
 (10)가 (D) (10)가 ,
 가 가 ,
 가
 (10) (12) (10)가 ,
 (G) (D) (14)가 (12)
 , (12) (G) (D) , (G) (D)
 (TFT) , (Clc)
) ()
 (D)
 , / (14) / (16, 18) ,
 / (14') / (16', 18')
 (14, 14') / (16, 18)
 / (16', 18') , / (G, D) ,
 .
 2a 2b MPS
 , 2a 2 , 2b 4
 .
 2a 2b , MPS (21) (16, 16', 18, 18')
 (16, 16 , 18, 18) ('MUX')(30) MUX(30)
 (50) (probe pin) (40) 2 4 (21)
 .
 MPS 2 4 (21) (20)
 (21) (16, 16', 18, 18') (40)가
 (21)
 , (40) 4 (41) , GO (18) (16)
 , GE , DE (18') 가 DO
 (16')
 , (40) 4 가 (20) 4 (21)
 (2b) 4 (21)
 .
 MPS (20) , (21)
 / (41) (18, 16) , / (16, 18) (18', 16')
 , / (G, D) (16', 18')
 .
 가 (21) MPS ()
 , (+) 가 가 , 가 , (-) 가
 가 , 가
 ,
 , MPS (30) (40)가 2 4 2
 (21) (20) (2a) 2 (30) (40)
)
 ,
 ,

(20) (16, 16', 18, 18') (80) MPS (70, 70') 2 4 (21)

, (21) 2 4 가 (21) 1 (20) ,

1) 2 4 (21) (20) (2 (21)

) (16, 16', 18, 18') (70, 70')

, (70, 70') 4 (71) , GO (21)

DO (18) , GE (18') 가 (16')

(16) , DE (16') .

) , 4 (60) (70) 2 4 가 (20

(21) (21) (3b) (70, 70') 4

(21) .

/ (20) , (21)

(18, 16) , / (18', 16')

(60) (71) , / (G, D) (16, 18)

(16', 18') , ,

, 가 (+) 가 가 (21) , 가 MPS 가 , (-) 가 가

, 2 (21) (20) (3a) (C)

(70') (70') 2 (21) (71')

4 (GO, GE, DO, DE) (70') , , (71') (-) 가

(C) 가 .

, 4 (70, 70') (21) (16, 16', 18, 1

8') (70') (71') (C) (21) (C) (90)가

) , (71')

, (90) 2 (21) (20) (3a) (on)

(20) (3b) (off) (C) , 4 (21) (C)

(71') (71') (70') (71)

(C) 가 , (60) (70')

, 가 (+) 가 가 (21) , MPS 가 , (-) 가 가

(D) (C) 가 가 , (C) (D)

, (C) (D)

, 4 (21) (20) (70, 70')
4 (21) .
, (90) (off) 4 (21) (20) (3b)
(21) 4 (70, 70') (71') (C) (16, 16', 18, 18') 4 ,

(57)

1.

2 4
,

가

2.

1 ,
2 4 ,
4 .

3.

1 2 ,
2 2 2

4.

1 2 ,
2 , 4 .

5.

1 2 ,
가 가

6.

2 4 4 2 ,

2

4

2

2

2

가

가

7.

6

가

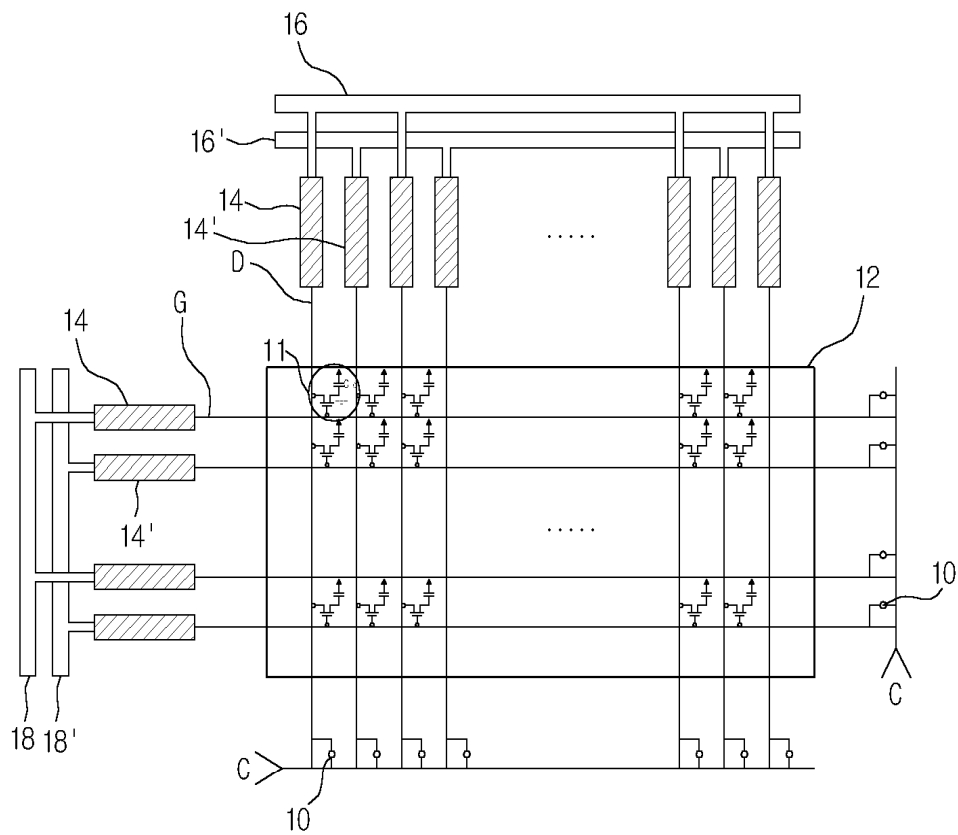
8.

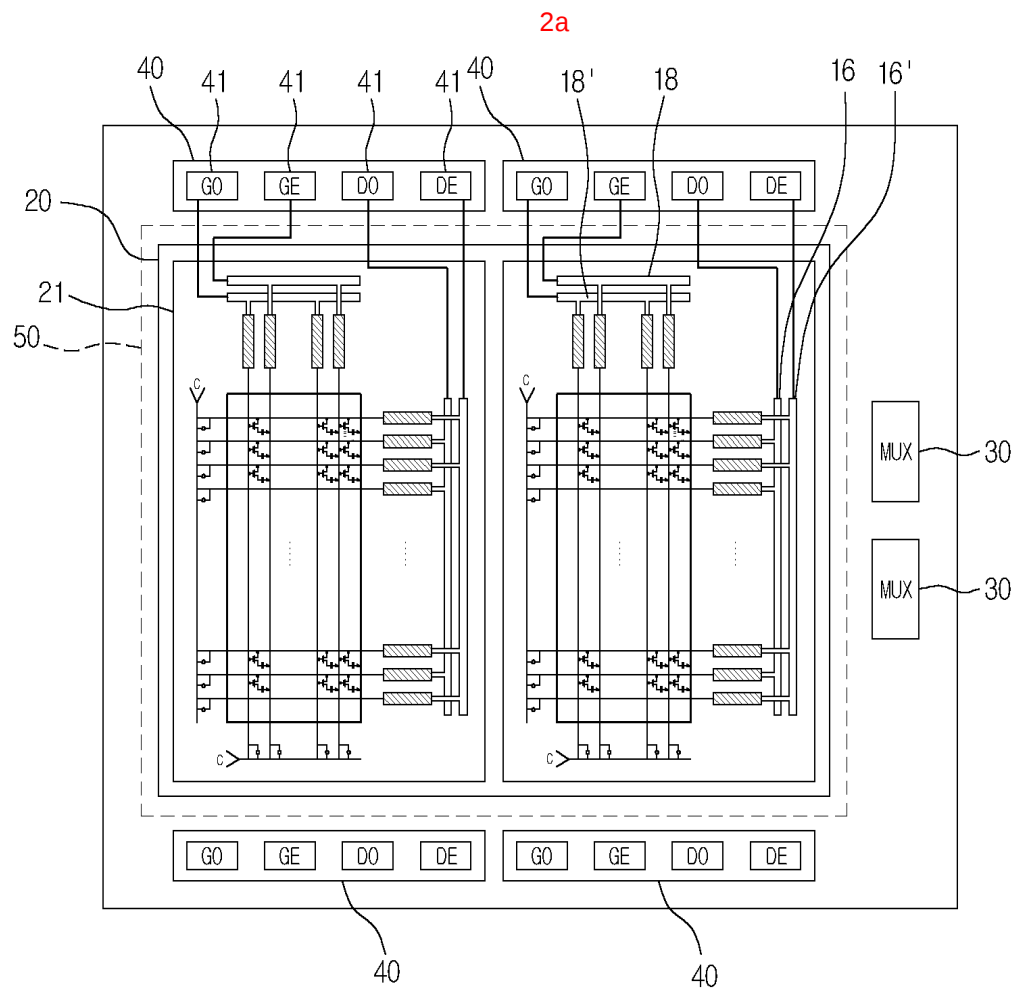
6

4

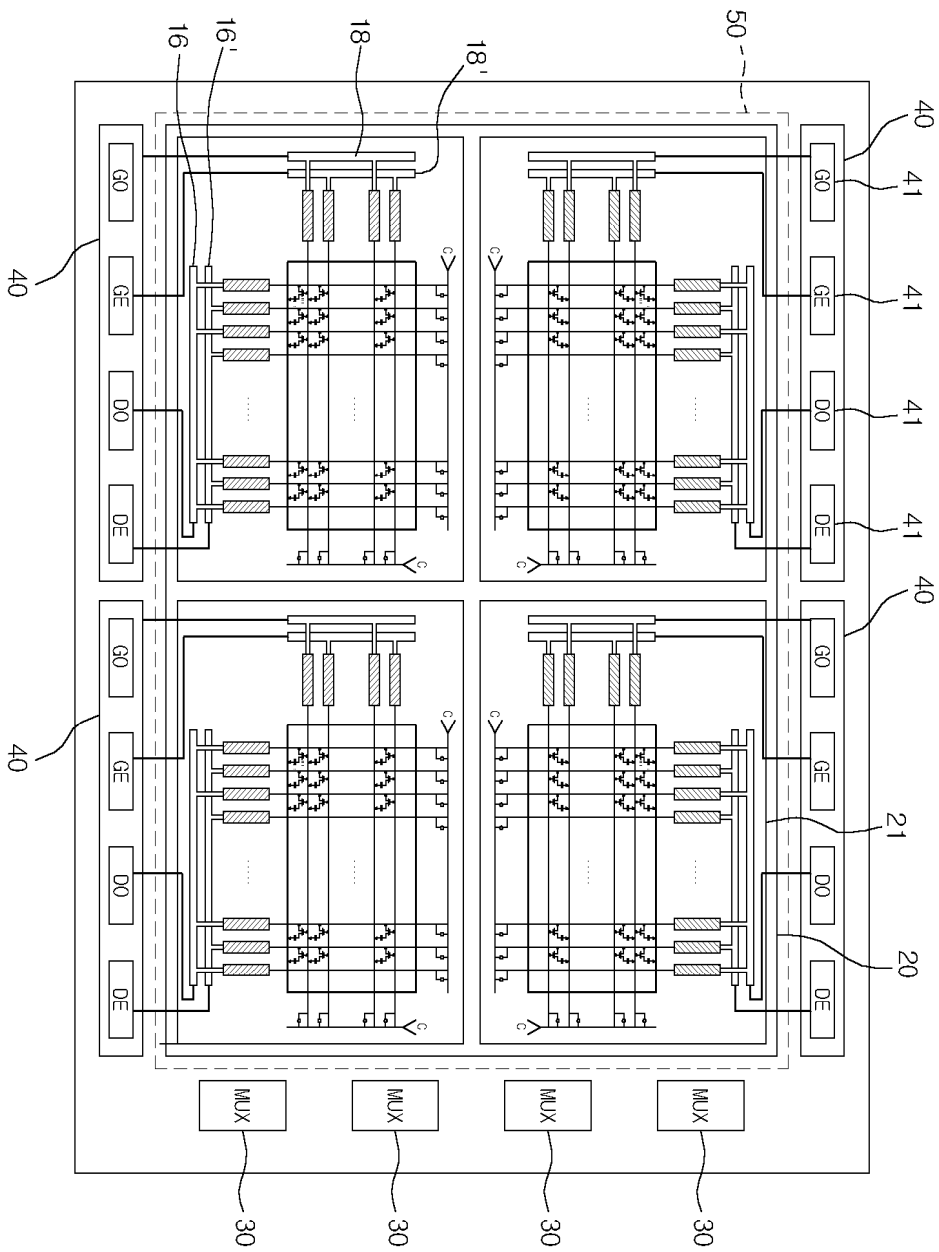
가

1

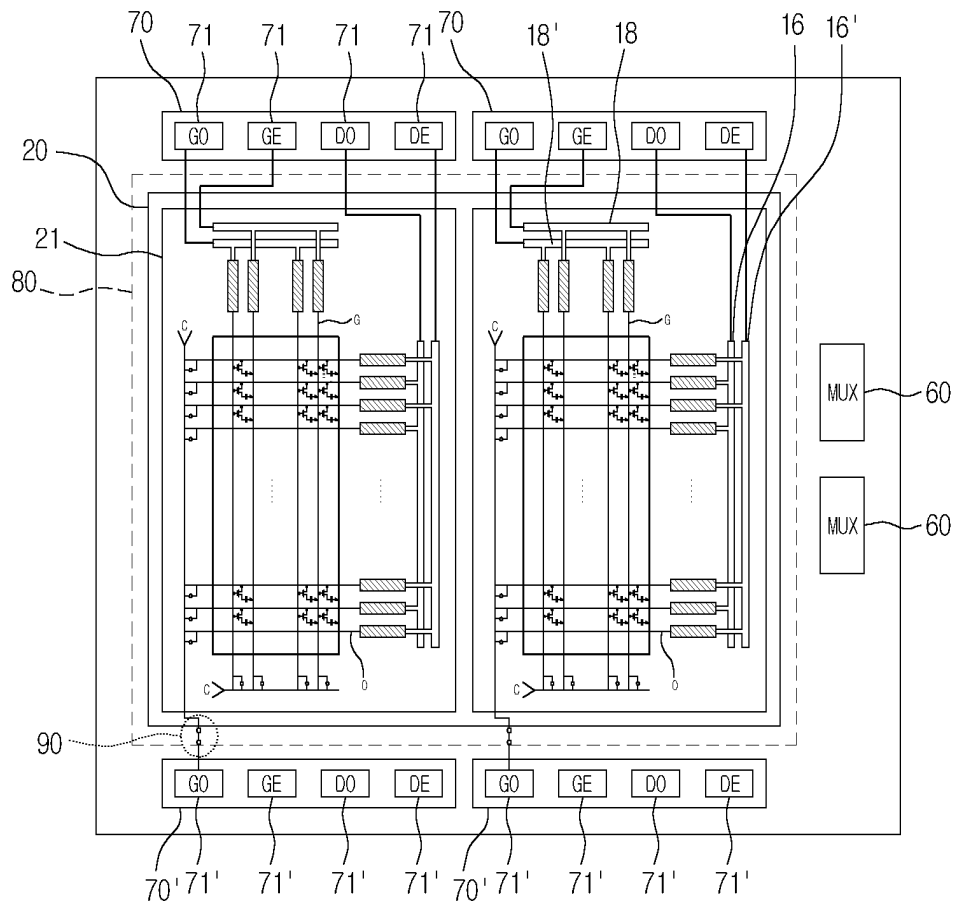




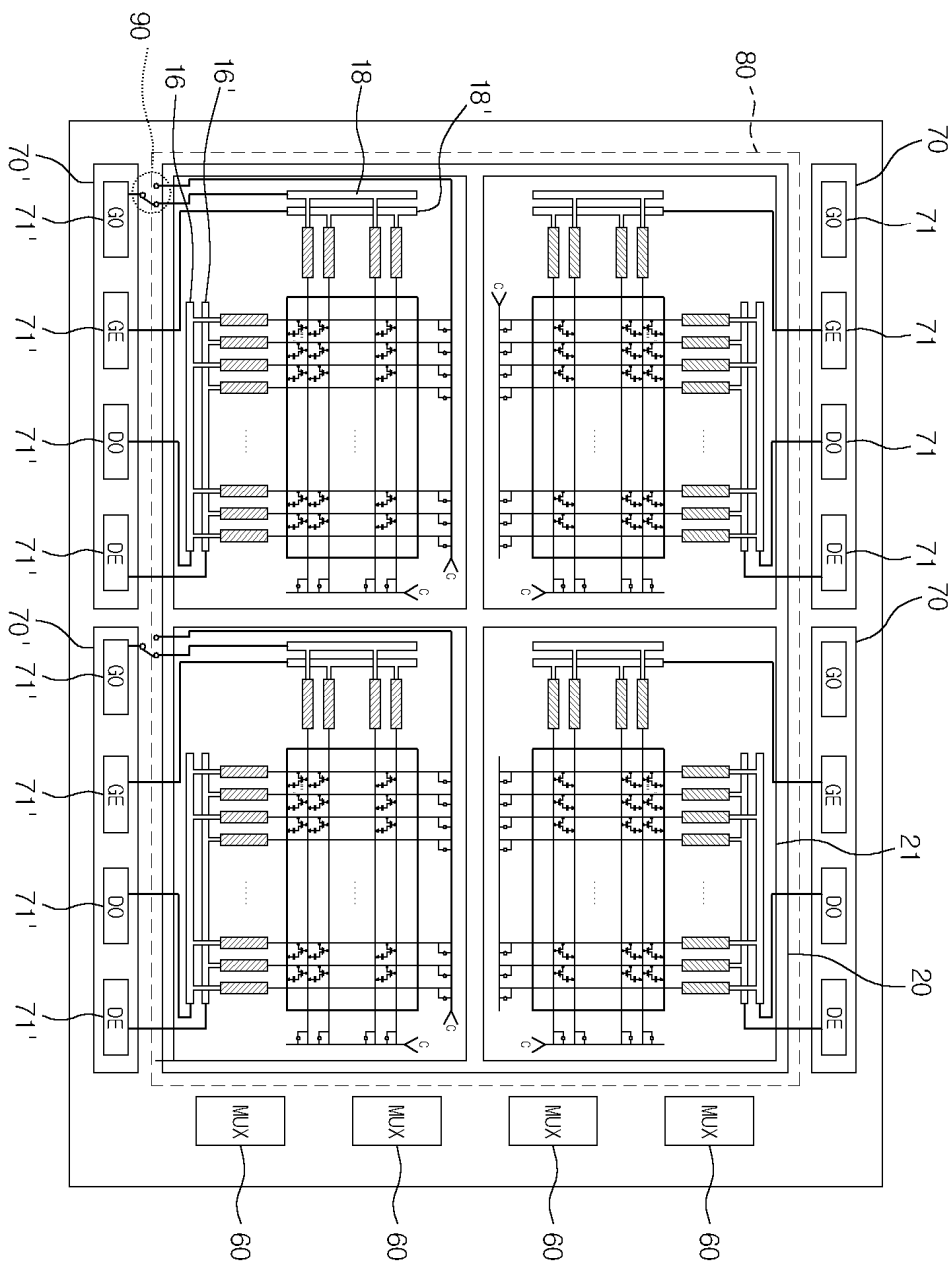
2b



3a



3b



专利名称(译)	液晶显示器的阵列基板的检查装置及检查方法		
公开(公告)号	KR1020040062051A	公开(公告)日	2004-07-07
申请号	KR1020020088364	申请日	2002-12-31
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	CHO INKWAN 조인관 HWANG HYUCK 황혁		
发明人	조인관 황혁		
IPC分类号	G02F1/13		
其他公开文献	KR100909781B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

对于根据本发明的液晶显示装置的阵列基板的检查时，探针和栅极显示tingba和数据短路棒多路复用器和多路转换器，以提供设置在阵列基板上，并连接作为阵列基板的各个短路的扫描信号一种用于液晶显示装置的阵列基板检查装置，包括其中放置有形成有两个或四个阵列基板的玻璃基板的空间，所述探针与过量探针的未连接到阵列基板翅片的杆短路阵列基板探针的预定公共电极线连接，在与所述预定探针和公共电极线连接的部分浸提供开关。这样，根据本发明，为了更可靠地区分的阵列基板的数据线的断开是否改善geomchulryeok差，有效地利用在测试装置的探针的的额外好处。图3A

